1997-308351 DERWENT-ACC-NO: DERWENT-WEEK: 199730

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

Die bonding method of semiconductor chip e.g. LED, diode - involves heating expansion tape and which semiconductor wafer, partitioned into chip units is fixed, thereby

slicing individual chip units

PATENT-ASSIGNEE: ROHM CO LTD[ROHL]

PRIORITY-DATA: 1995JP-0278046 (October 25, 1995)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC JP 09120968 A May 6, 1997 N/A 005 H01L

021/52

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE

JP 09120968A 1995JP-0278046 N/A October 25, 1995

INT-CL (IPC): H01L021/301, H01L021/52 , H01L021/68 , H01L023/32

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 09120968A

BASIC-ABSTRACT:

The method involves fixing a partitioned semiconductor wafer (7) on an

expansion tape (8) through an adhesion layer.

The expansion tape is heated by which it expands and the semiconductor wafer is cut along the partitions to obtain individual chips. The chips are later peeled off.

ADVANTAGE - Ensures work efficiency. Simplifies alignment. Realizes effective die bonding.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.3/4

TITLE-TERMS: DIE BOND METHOD SEMICONDUCTOR CHIP LED DIODE HEAT EXPAND TAPE SEMICONDUCTOR WAFER PARTITION CHIP UNIT FIX SLICE INDIVIDUAL CHIP UNIT

DERWENT-CLASS: U11

EPI-CODES: U11-C06A2; U11-D01B1; U11-E02A3; U11-F02A3;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1997-255518

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-120968

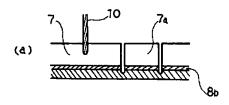
(43)公開日 平成9年(1997)5月6日

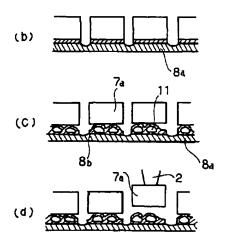
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所	
H01L 2	1/52			H01L	21/52		F		
2	1/68			•	21/68		N		
2	1/301				23/32		В		
2	3/32				21/78		P		
							Y		
				審査	請求 有	請求項の	X3 OL	(全 5 頁)	
(21)出顧番号		特顧平7-278046		(71)出願	人 000116	6024			
				口一厶株式会社					
(22)出顧日		平成7年(1995)10		京都府	京都市右京	区西院灣崎	叮21番地		
				(72)発明	者 波多野	和史			
					岡山県	经 岡市富岡	ワコー株	式会社内	
				(72)発明	者 大島	辰彦			
					岡山県	经 岡市宮岡	ワコー株	式会社内	
		*							

(54) 【発明の名称】 半導体チップのダイボンディング方法

(57)【要約】

【課題】 半導体チップのダイボンディング方法において、位置合わせを容易化し及び作業効率の向上を図る。 【解決手段】 発砲シートが貼着されて成るエキスパンドテープに保持した半導体ウエハを分割して半導体チップとした後、エキスパンドテープを伸張させた状態でこれを加熱することにより発砲シート内に発砲を発生させた状態で半導体チップをエキスパンドテープから剥離すると共に被ボンディング体上にダイボンディングする。





【特許請求の範囲】

【請求項1】個別に分割した半導体チップを被ボンディング体上にダイボンディングするダイボンディング方法であって、加熱により発泡を生じる発泡シートが貼着され且つ表面に粘着層が形成されたエキスパンドテープ上に貼着した半導体ウエハを分割して個別の半導体チップとし、前記エキスパンドテープを伸張させた状態で前記エキスパンドテープを加熱することにより前記発泡シート内に発泡を生ぜしめ、次いで、半導体チップを前記エキスパンドテープから剥離すると共に被ボンディング体 10上にダイボンディングすることから成ることを特徴とする半導体チップのダイボンディング方法。

【請求項2】前記発泡シートは半導体チップの裏面の短辺より小さい寸法のピッチで発泡する請求項1に記載のダイボンディング方法。

【請求項3】前記発泡シートの加熱は2方向に移動可能なX-Yテーブルに搭載されたヒートブロックにより行う請求項1に記載のダイボンディング方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、分割された半導体 チップを被ボンディング体上にボンディングするダイボ ンディング方法に関する。

[0002]

【従来の技術】ダイオードやLED等の素子を構成する 半導体チップは、一般に、写真蝕刻法により不純物導入 のための拡散やエッチング等の処理をウエハ状態の半導 体基板に施すことによりその表面に複数の素子を形成 し、これらの素子をダイシング等による分割を施すこと により個別素子化されている。半導体ウエハの分割によ 30 り個別素子化された半導体チップは、その用途や目的に 応じて、リードフレームや回路基板等の被ボンディング 体上にダイボンディングすることにより搭載され、その 後の半田リフロー等の工程を介して固着される。

【0003】このような半導体チップのダイボンディングは、複数の素子が形成されたウエハを粘着性の表面を有する伸張性のエキスパンドテープ上に保持させた状態でダイシング等により個別の半導体チップに分割後、エキスパンドテープを伸張させることにより半導体チップ相互間を適度に離間させた状態で個々の半導体チップに40ついて吸着コレットを用いてエキスパンドテープからの剥離及び移送を介して行っている。

【0004】このようなダイボンディングは、一般に、図4に示すようなダイボンディング装置を使用して実施されている。ダイボンディング装置は、水平方向に移動可能に図示しないX-Yテーブルに搭載されたスリーブ状の基体21と、基体21の外周に沿って移動可能な円環状のエキスパンドリング22と、基体21の内側に固定され内孔23aを有するやはりスリーブ状の円筒部材23と、円筒部材23の軸心に沿って垂直方向に移動可50

能に設けられた突出針24と、基体21の上方で水平及び垂直方向に移動可能に設けられた吸着コレット25と、から構成されている。吸着コレット25には、その軸心方向に通孔25aが形成されており、通孔25a内に作用されるバキュームにより先端での半導体チップのピックアップを可能にしている。円筒部材23の上面は半導体チップのピックアップステ

ージとして作用するように形成されている。

2

【0005】このような装置を用いたダイボンディング では、まず、複数の半導体チップを保持したエキスパン ドテープ26の外周をエキスパンドリング22に装着 し、これを基体21の外周に沿って押し下げることによ りエキスパンドテープ26を伸張させ、エキスパンドテ ープ26上に保持された半導体チップを相互に離間させ た状態で、ダイボンディングすべき半導体チップ27を 円筒部材23の内孔23a上に位置合せし、次いで、内 孔23a内にバキュームを作用させてエキスパンドテー プ25を内孔23a内に吸引すると共に内孔23a内の 突出針24をエキスパンドテープ26を突き破って上方 20 に突出させることにより半導体チップ27をエキスパン ドテープ26から剥離させ、これを吸着コレット25に よりピックアップし、図示しない被ボンディング体に向 けて移送し及び載置することによりダイボンディングを 施している。

【0006】このように、任意の半導体チップについてのダイボンディング工程が終了したら、X-Yテーブルによる基体21、従ってエキスパンドテープ26、の移動により次の半導体チップに位置合せを行った状態で、同様にダイボンディング工程が繰り返される。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述したような従来の方法では、突上げ針24とコレット25との間のセンター合わせと共に両者24、25間の隙間寸法の調整に正確な調整が要求され、これらが的確になされていないとコレットによる半導体チップの吸着が正しくなされずに、半導体チップが吸着されなかったりまたは不適正な状態で吸着されたりしてダイボンディング工程に大きな支障をきたすことになる。

【0008】また、従来の方法では、エキスパンドテープの通孔内への吸引は電磁弁を用いたエアの制御によりバキュームを発生させ及びこれを解除することにより行っているのだが、電磁弁への電気信号の伝達からバキュームを介したエキスパンドテープの実際の吸引またはその解除までの応答時間の遅れが生じ、バキューム解除による吸引されたエキスパンドテープの復帰が終了しないうちにX-Yテーブルによる位置合せが行われた場合には、突上げ針24によるエキスパンドテープ26の裂損を招き、作業工程に大きな支障をきたす。

【0009】更に、上述のような個々の半導体チップの ダイボンディング工程における応答時間の遅れは、全半 3

導体チップに対して鑑みた場合、作業効率に対する問題 にもなる。従って、本発明の目的は、位置合わせを容易 化し及び作業効率の向上を図った半導体チップのダイボ ンディング方法を得ることにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記課題を達成するため、請求項1に記載の半導体チップのダイボンディング方法は、個別に分割した半導体チップを被ボンディング体上にダイボンディングするダイボンディング方法であって、加熱により発泡を生じる発泡シートが貼着され且 10 つ表面に粘着層が形成されたエキスパンドテープ上に貼着した半導体ウエハを分割して個別の半導体チップとし、エキスパンドテープを伸張させた状態でエキスパンドテープを加熱することにより発泡シート内に発泡を生ぜしめ、次いで、半導体チップをエキスパンドテープから剥離すると共に被ボンディング体上にダイボンディングすることから成ることを特徴とする。

【0011】請求項2に記載の半導体チップのダイボンディング方法は、請求項1の方法において、発泡シートは半導体チップの裏面側の短辺より小さい寸法のピッチ 20で発泡することから成る。請求項3に記載の半導体チップのダイボンディング方法は、請求項1の方法において、発泡シートの加熱を2方向に移動可能なX-Yテーブルに搭載されたヒートブロックにより行うことから成る。

[0012]

【発明の実施の形態】次に、本発明による半導体チップ のダイボンディング方法について実施の形態を図面を参 照しながら詳細に説明する。まず、本発明のダイボンデ ィングに使用されるダイボンディング装置は、図1に示 30 すように、内部に加熱のための図示しないヒータが内蔵 された金属製の円筒から成るヒータブロック1と、軸心 方向に内部通孔2 aが形成された円筒状の部材から成る 吸着コレット2と、吸着コレット2をヒータブロック1 の上方で水平及び垂直方向に移動可能に保持する図示し ないコレット移動機構と、バキュームを発生させるため の真空ポンプから成るバキューム発生源3と、バキュー ム発生源3により発生されたバキュームをコレットの内 部通孔内に作用させるためにバキューム源とコレットの 内部通孔との間を接続するチューブ4と、から成ってい 40 る。ヒータブロック1は水平方向に移動可能なX-Yテ ーブル5上に搭載されており、また、ヒータブロック1 またはコレット2の上方には図示しないモニターカメラ が設けられている。

【0013】ヒータブロック1上には、表面に複数の半 導体チップ7aを保持するエキスパンドテープ7がその 周縁にて係止されたエキスパンドリング9を介して伸張 状態で支持されている。エキスパンドテープ8は、図2 に断面を示すように、伸張性を有する基材フィルムとし てのテープ本体8aと、テープ本体8aに裏面にて貼合 50 的に剥離された状態になる。

1

された熱発泡性の発泡シート8bと、発泡シート8bの表面に形成された粘着材8cと、から成っている。この発泡シートは、一定の温度、例えば約100℃、に加熱することにより発泡を生じるように形成されている。【0014】本発明の半導体チップのダイボンディング方法は、上述のような構成の装置及びエキスパンドテープを使用して以下のように実施する。まず、従来と同様に、写真触刻法により不純物の拡散やエッチング等の工程を介して複数の素子が表面に形成された半導体ウエハを準備する。ウエハの表面側には、例えば、LED素子を構成する拡散領域と共にそれらに接続された金属から

【0015】このようなウエハを準備したら、図3 (a)に示すように、ウエハ7を上述したような構成のエキスパンドテープ8に貼着した状態でダイシングブレード10を用いたダイシングによるフルカットを施すことにより個別素子としての半導体チップ7aに分割する。この場合のダイシングはここでは図示を省略する粘着材と共に発泡シートも同時にカットされるような深さで行う。

成る表面電極が形成され、他方裏面側にはやはり金属か

ら成る裏面電極が全面的に形成されている。

【0016】ウエハを分割したら、エキスパンドテープ 8をその外周にてエキスパンドリングに装着し、中央部 分に保持した半導体チップがピックアップステージとし てのヒータブロック1上に位置するようにテープ本体8 aが伸張されるようにエキスパンドリングを下方に押し 下げた状態でヒータブロックに固定する。このようなエ キスパンドテープ8の伸張により、図3(b)に示すよ うに、半導体チップは発泡シート8bと共に、相互に離 間された状態でヒートブロック1上に配置されることに なる。半導体チップ7a相互間の間隔はエキスパンドリ ングの押し下げによるエキスパンドテープ8の伸張量に より決定されるのだが、本発明の方法では、従来の方法 で用いていたような円筒部材やその内孔及びこれによる エキスパンドシートの吸引や突き上げ針による突上げ等 を必要としないので、半導体チップ間の間隔はコレット による半導体チップ7 aのエキスパンドテープ8からの ピックアップが可能な間隔を確保し得る程度にエキスパ ンドテープの伸張がなされれば足りる。

【0017】エキスパンドリングによりエキスパンドテープ8を伸張したら、エキスパンドリングを固定した状態で、ヒータブロックに内蔵したヒータに電流を供給することにより、エキスパンドテープ8の発泡シート8bに発泡を生じる温度より高い温度、例えば約100℃、になるまでヒータブロックを加熱する。このようなヒータブロック、従って発泡シート8b、の加熱により発泡シート8bは、図3(c)に示すように、発泡11を生じ、各半導体チップ7aはテープ本体7aに対して上方に押し上げられると共にエキスパンドテープ8から部分的に制度される状態になる

5

【0018】このように、半導体チップが発泡シートから部分的に剥離された状態で、図3(d)に示すように、吸着コレット2を任意の半導体チップ7aに向けて下降させバキュームによる吸着によりエキスパンドテープ8から剥離すると共にこれを上方へピックアップし、被ボンディング体の所要の箇所に向けて移送し及びボンディングすることにより任意の半導体チップについてのダイボンディング工程が完了する。

【0019】このように1個の半導体チップについてのダイボンディングを完了したら、X-Yテーブルの移動 10により次にダイボンディングすべき半導体チップに位置合せを行い、同様の工程を繰り返す。このような工程を各半導体チップについて順次繰り返すことにより、ウエハ単位のダイボンディングが完了される。本発明方法に使用する発泡シートとしては、その発砲のビッチをダイボンディングすべき半導体チップのサイズや形状等に応じて決定すればよいのだが、発砲時に半導体チップをより水平な良好な状態に保持させるために、発砲のピッチ(P)を半導体チップの裏面側の短辺幅(W)よりも小さな値、より好ましくは0.2W<P<0.7Pの範囲 20の値、に設定することにより、エキスパンドテープ上でにより良好な保持およびこれからの剥離を得ることができる。

【0020】また、上述の説明では、ウエハに形成し及びこれを分割して得る半導体チップとして、LED素子を例に説明したが、本発明はこれに限られることなく、通常のダイオードやトランジスタまたはIC等の素子にも同様に適用可能なことはいうまでもない。

[0021]

【発明の効果】以上に詳細に説明したように、本発明の 30 半導体チップのダイボンディング方法によれば、加熱により発泡を生じる発泡シートが貼着され且つ表面に粘着層が形成されたエキスパンドテープ上に貼着した半導体ウエハを分割して個別の半導体チップとし、前記エキスパンドテープを伸張させた状態で前記エキスパンドテープを加熱することにより前記発泡シート内に発泡を生ぜ

しめ、次いで、半導体チップを前記エキスパンドテープから剥離すると共に被ボンディング体上にダイボンディングすることから成るので、従来の方法におけるような突上げ針とコレットとの間のセンター合わせやこれらの間の隙間寸法における厳密な調整を要することはなく、発砲シートに生じた発砲がコレットによるピックアップ時のクッションとして作用し、以て、半導体チップのピックアップをより確実ならしめる。

【0022】また、半導体チップのピックアップは、一旦発砲させた発砲シート上の半導体チップを順次ピックアップ及びボンディングしてゆけばよいので応答時間の遅れが生じるおそれもほとんどなく、より効率的なダイボンディングが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の方法に適用されるダイボンディング装置の断面図である。

【図2】本発明の方法に適用されるエキスパンドテープの断面図である。

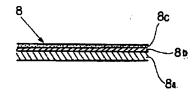
【図3】本発明のダイボンディング方法の主要工程を示す図である。

【図4】従来の方法に適用されているダイボンディング 装置の断面図である。

【符号の説明】

- 1 ヒータブロック
- 2 吸着コレット
- 3 バキューム発生源
- 5 X-Yテーブル
- 7 半導体ウエハ
- 7a 半導体チップ
- 8 エキスパンドテープ
 - 8a テープ本体
 - 8b 発砲シート
 - 8c 粘着材
 - 9 エキスパンドリング
 - 11 発砲

【図2】



【図4】

